

НЕГАУССОВЫ ФЛУКТУАЦИИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В КВАНТОВЫХ ПРОВОДНИКАХ

Г.Б.Лесовик

*Институт физики твердого тела РАН
142432 Черноголовка, Россия*

Поступила в редакцию 8 ноября 1994 г.

В квантовом проводнике флуктуации тока и напряжения негауссовые. Обсуждаются различные источники негауссности. В качестве примера явления, где негауссность существенна, рассмотрен сдвиг частоты джозефсоновской генерации.

В неравновесном состоянии статистика переноса заряда через проводник, как правило, негауссова. Классический хорошо известный тому пример – это электронный ток в катодных лампах в режиме насыщения. Как было указано Шоттки [1], статистика переноса в этом случае может считаться пуассоновской с характеристической функцией

$$\chi_p(\Lambda) = \langle \exp(i\Lambda N) \rangle = \exp[\exp(i\Lambda) - 1] \langle N \rangle. \quad (1)$$

Здесь $\langle N \rangle$ – среднее число прошедших через лампу электронов, скобки $\langle \rangle$ означают усреднение. Наличие флуктуаций при этом связано с дискретностью заряда электронов. Это хорошо видно из выражения для среднего квадрата флуктуации перенесенного заряда Q [1]: $\langle \delta Q^2 \rangle = t e \langle I \rangle$. Действительно, зафиксировав ток и устремив заряд e к нулю получим $\langle \delta Q^2 \rangle = 0$. Другой пример – это биномиальное распределение заряда перенесенного через когерентный квазиодномерный проводник с прозрачностью T , изученное в работах [2]. При условии $V \gg \Theta$, где V – тянувшее напряжение, Θ – температура, характеристическая функция такого распределения

$$\chi_b(\Lambda) = \left[1 + T(\exp(i\Lambda) - 1) \right]^{(N)/T}. \quad (2)$$

При этом квадрат флуктуаций заряда $\langle \delta Q^2 \rangle = t e \langle I \rangle (1 - T)$ опять-таки обращается в нуль при $e = 0$. Квантовый дробовой шум обусловлен дискретностью заряда, как и классический, и вероятностной природой туннелирования электронов через барьер. Существенным для дальнейшего обсуждения будет то, что для двух упомянутых случайных процессов кубические (а также все нечетные) неприводимые корреляторы отличны от нуля ($\langle \delta Q^3 \rangle = e^2 t \langle I \rangle$ для пуассоновского процесса, и $\langle \langle \delta Q^3 \rangle \rangle = e^2 t \langle I \rangle (1 - T)(1 - 2T)$ – для бернуллиевского). Здесь двойные скобки $\langle \langle \rangle \rangle$ означают неприводимый коррелятор. Приведем, наконец, последний пример. В мезоскопическом когерентном проводнике изменение положения одной примеси приводит к изменению полной проводимости $G = R^{-1}$ на величину порядка [3]

$$\delta G \sim \frac{e^4}{\hbar^2} R.$$

Флуктуации тока из-за скачков примеси, без учета других источников шума можно представить как $\delta I(t) = \delta G(t)V$. Характеристическая функция

$$\chi_{im}(\Lambda) = \exp \left([i\Lambda \int_0^{t_0} \delta I(t) dt] \right),$$

для случая одной мобильной примеси на временах $t_0 \gg \Gamma^{-1}$:

$$\chi_{im}(\Lambda) = \exp \left[-t_0 \Lambda^2 (\Delta GV)^2 \frac{\gamma_1 \gamma_2}{\Gamma^3} \left(1 - i\Lambda \Delta GV \frac{\Delta \gamma}{\Gamma^2} \right)^{-1} \right]. \quad (3)$$

Здесь γ_1 – обратное время перехода из состояния 1 с кондактансом G_1 в состояние 2 с кондактансом G_2 , γ_2 – скорость обратного перехода; $\Delta G = G_1 - G_2$; $\Delta \gamma = \gamma_1 - \gamma_2$; $\Gamma = \gamma_1 + \gamma_2$. Ясно, что и флуктуации напряжения в цепи со стабилизированным током, содержащей источники негауссовых флуктуационных токов, будут также иметь нетривиальную статистику с ненулевыми неприводимыми корреляторами старших порядков. Обсудим, какие это будет иметь последствия на примере джозефсоновской генерации. Влияние флуктуаций напряжения на ширину линии анализировалось в работе [4] в предположении, что флуктуации гауссовые. В результате усреднения по флуктуациям выражения

$$\Phi(t) = \langle I(t') I(t' + t) \rangle = \langle \text{Re} \exp \left[i \frac{2e}{\hbar} \int_0^t (V_0 + \delta V(t')) dt' \right] \rangle,$$

характеризующего генерацию с затуханием, авторы [4] получили:

$$\Phi(t) \sim \text{Re} \exp \left(i\omega_J t - \lambda(t)t \right), \quad (4)$$

где при $t \rightarrow 0$

$$\lambda(t) = t \frac{1}{2} \left(\frac{2e}{\hbar} \right)^2 \langle \delta V^2(0) \rangle,$$

при $t \rightarrow \infty$

$$\lambda(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{2e}{\hbar} \right)^2 \langle \delta V_{\omega=0}^2 \rangle.$$

Здесь $\langle \delta V_{\omega=0}^2 \rangle$ – фурье-образ парного коррелятора на малой частоте, $\omega_J = \frac{2e}{\hbar} V_0$. Для негауссовых флуктуаций вместо выражения (4) получим

$$\Phi(t) \sim \text{Re} \exp \left([i\omega_J t - \lambda(t)t + i\Delta\omega_J(t)t] \right).$$

При этом

$$-\lambda(t)t = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{i2e}{\hbar} \right)^{2k} \frac{1}{(2k)!} \int \dots \int_0^t dt_1 \dots dt_{2k} \langle \langle \delta V(t_1) \dots \delta V(t_{2k}) \rangle \rangle, \quad (5)$$

$$i\Delta\omega_J t = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{i2e}{\hbar} \right)^{2k+1} \frac{1}{(2k+1)!} \int \dots \int_0^t dt_1 \dots dt_{2k+1} \langle \langle \delta V(t_1) \dots \delta V(t_{2k+1}) \rangle \rangle. \quad (6)$$

В пределе $t \gg \tau_{corr}$, где τ_{corr} - корреляционное время случайного процесса $\delta V(t)$, из формул (5), (6) получим

$$\Delta\omega_J = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2e}{\hbar}\right)^{2k+1} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \langle\langle \delta V_{\omega=0}^{2k+1} \rangle\rangle, \quad (7)$$

$$\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2e}{\hbar}\right)^{2k} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!} \langle\langle \delta V_{\omega=0}^{2k} \rangle\rangle. \quad (8)$$

Как видно из (7), частота джозефсоновской генерации зависит не только от среднего напряжения на контакте $\langle V \rangle = V_0$, но и от статистики в целом. Формула (8) показывает, что ширина линии определяется не только вторым кумулянтом флюктуаций, но и всеми старшими. При $t \ll \tau_{corr}$ имеем $\Delta\omega_J \sim t^3$, в этом случае скорее следует говорить об "уплывании" частоты, чем о ее сдвиге. Оценим величину эффекта, используя приведенные выше примеры негауссовых процессов. Рассмотрим цепь со стабилизированным током величиной I , включающую в себя джозефсоновский переход с нормальным сопротивлением r и соединенный с ним последовательно мезоскопический резистор R . Пренебрежем на время всеми флюктуациями кроме флюктуаций сопротивления R , это разумное приближение, если примесей меняющих положение много. Тогда

$$\delta V = -I\delta R \approx -I \frac{\delta G}{G^2}.$$

Интересующее нас среднее

$$\Phi(t) = \langle \text{Re} \exp [i \frac{2e}{\hbar} \int_0^t \delta V(t)' dt'] \rangle = \langle \text{Re} \exp [-i \frac{2e}{\hbar} \frac{I}{G^2} \int_0^t \delta G(t)' dt'] \rangle$$

может быть переписано с помощью характеристической функции (3) следующим образом:

$$\Phi(t) = \text{Re} \chi_{im} \left(-\frac{2e}{\hbar} R \right).$$

Тогда сдвиг частоты при $\frac{e}{\hbar} R^2 \Delta G I \frac{\Delta\gamma}{\Gamma^2} \gg 1$

$$\Delta\omega_J \simeq \frac{2e}{\hbar} R^2 I \sum_{im} \Delta G \frac{\gamma_1 \gamma_2}{\Gamma \Delta\gamma}.$$

В этой формуле вклады от всех примесей предполагаются просуммированными независимо, что является хорошим приближением при $\frac{e^2 R}{\hbar} \ll 1$. Оценка для сдвига частоты $\Delta\omega_J \sim \frac{I}{e} \left(\frac{e^2 R}{\hbar} \right)^3 N_{im}$, где N_{im} - число мобильных примесей.

Обратимся теперь к флюктуациям из-за дискретности заряда. Если флюктуационные одночастичные токи δj через переход много больше критического тока, можно пренебречь нелинейностью джозефсоновского перехода и считать, что $\delta V = -\delta j r$. Тогда

$$\Phi(t) = \text{Re} \chi \left(-\frac{2er}{\hbar} \right),$$

где

$$\chi(\Lambda) = \langle \exp [i\Lambda \int^t \delta J dt'] \rangle.$$

Предположив, что процесс переноса заряда пуассоновский, получим

$$\Phi(t) = \exp \left(\left[\exp \left(-i \frac{2e^2 r}{\hbar} \right) - 1 \right] \frac{It}{e} + i \frac{It}{e} \frac{2e^2 r}{\hbar} \right),$$

откуда можно заключить, что

$$\Delta\omega_J = \text{Im} \frac{I}{e} \left(\exp \left(-i \frac{2e^2 r}{\hbar} \right) - 1 + i \frac{2e^2 r}{\hbar} \right)$$

и сдвиг частоты имеет осциллирующую зависимость

$$\Delta\omega_J = \frac{I}{e} \left(\frac{2e^2 r}{\hbar} - 1 - \sin \frac{2e^2 r}{\hbar} \right),$$

связанную с осцилляцией фазы $[\phi]_{mod\pi} = 2e/\hbar \int \delta V dt$, набираемой при нелировании одного электрона. Такой вывод видимо не вполне корректен. Проблема состоит в том, что при наличии флюктуирующего напряжения статистика переноса заряда меняется и становится не пуассоновой. Возможно, однако, что осцилляции сдвига частоты как функции сопротивления полностью размываются. Подробно этот вопрос предполагается изучен в будущем.

Автор благодарит Л.С.Левитова и Д.Е.Хмельницкого за весьма полезные обсуждения. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 93-02-2113) и МНФ (грант М9М000).

-
1. W.Schottky, Ann. d.Phys. **57**, 541 (1918).
 2. Г.Б.Лесовик, Письма в ЖЭТФ **49**, 514 (1989); Л.С.Левитов, Г.Б.Лесовик, Письма в ЖЭТФ **55**, 534 (1992); **58**, 514 (1993).
 3. Б.Л.Альтшуллер, Б.З.Спивак, Письма в ЖЭТФ **42**, 363 (1985); S.Feng, P.A.Lee, and A.D.McCormick, Phys. Rev. Lett. **56**, 1960 (1986).
 4. А.И.Ларкин, Ю.Н.Овчинников, ЖЭТФ **53**, 2159 (1967).